



Microelectronic failure analysis [desk reference : 2001 supplement /

ASM International,
c2001

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbgVlcmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMTcxMTQzMtQ>

Título: Microelectronic failure analysis [Recurso electrónico] desk reference : 2001 supplement prepared under the direction of the Electronic Device Failure Analysis Society Publications Committee

Editorial: Materials Park, OH ASM International c2001

Descripción física: v, 171 p. ill

Mención de serie: E-Libro

Bibliografía: Incluye referencias bibliográficas e índice

Detalles del sistema: Modo de acceso: Worl Wide Web

Fuente de adquisición directa: E-Libro

ISBN: 9780871707451 0871707454 pbk.)

Materia: Electronics- Materials- Testing- Handbooks, manuals, etc Microelectronics- Materials- Testing- Handbooks, manuals, etc Microelectronics- Materials- Defects- Handbooks, manuals, etc Electronic apparatus and appliances- Testing- Handbooks, manuals, etc Semiconductors- Defects- Handbooks, manuals, etc

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es